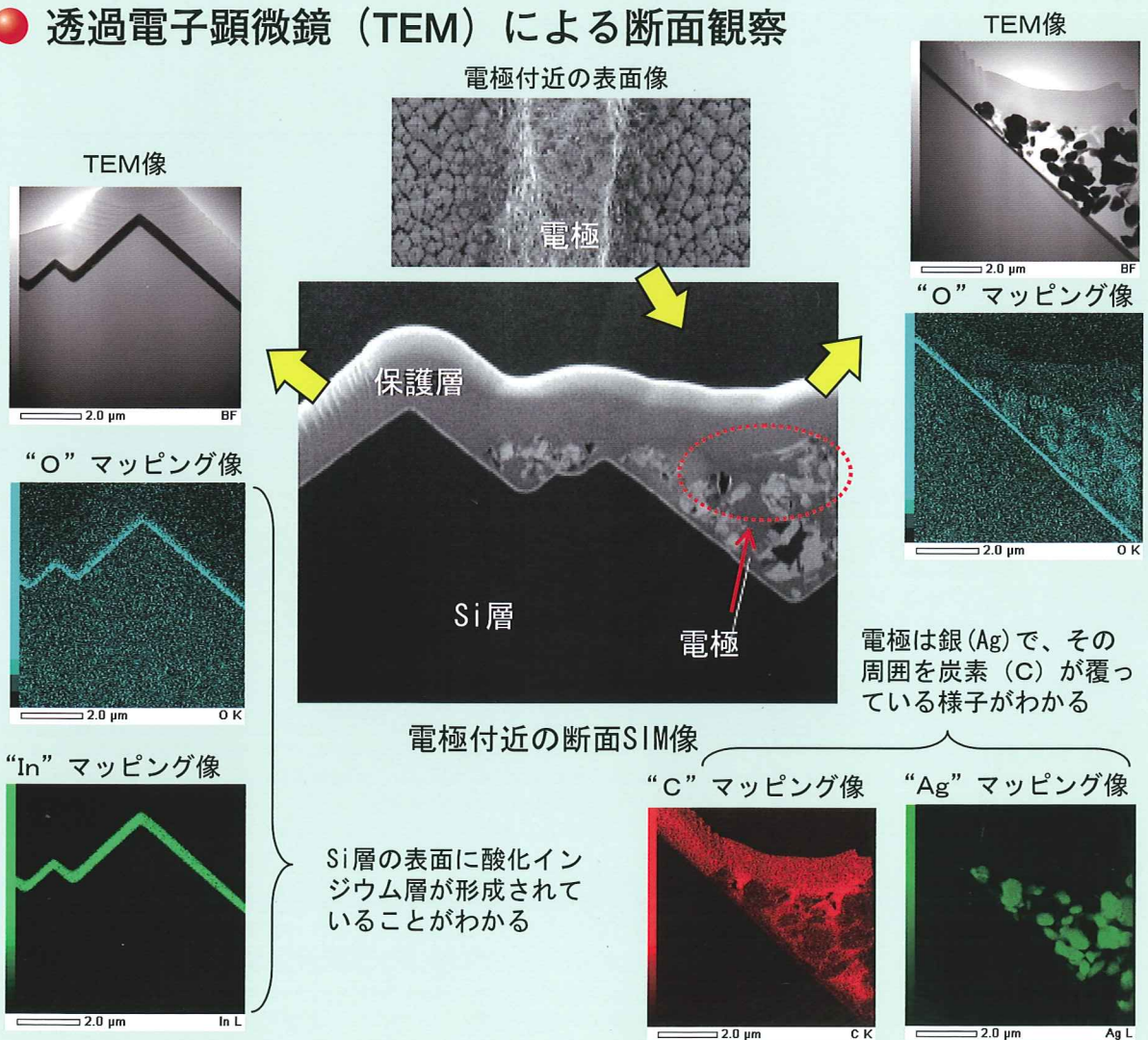


シリコン系太陽電池の断面観察 —透過電子顕微鏡(TEM)—

概要

太陽電池パネルのSi層電極付近を集束イオンビーム装置(FIB)により検体を作製し、電界放射型透過電子顕微鏡(FE-TEM)により形状観察及び元素マッピングを実施した。観察からシリコンの表面形状に関する情報を得る事ができる。また、元素マッピングからはシリコン表面上の酸化インジウムの製膜状態や、電極部で粒状化した銀(Ag)が樹脂(C)に覆われている様子が観察される。このように透過電子顕微鏡では層形成や電極の組成情報を得る事ができる。

● 透過電子顕微鏡 (TEM) による断面観察



株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎ 03-5524-3851